

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 188**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 3 z/of 25.04.2023

**Akredytacja zawieszona w całości zakresu na wniosek podmiotu
od 07.02.2024 r. do 07.08.2024 r.**

Accreditation voluntarily suspended at the request of the body in the full scope
from: 07.02.2024 to 07.08.2024

 <p>AP 188</p>	<p>Nazwa i adres / Name and address</p> <p>POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA KATEDRA METROLOGII I NIEKONWENCJONALNYCH METOD WYTWARZANIA Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce</p>
<p>Działalność prowadzona / Activity conducted</p> <p>w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)</p>	<p>Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand¹⁾ 6.01 długość¹⁾</p>

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS

**Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 188 z dnia 25.04.2023 r.
Cykl akredytacji od 25.04.2023 r. do 23.05.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl**

This document is an annex to accreditation certificate No AP 188 of 25.04.2023
Accreditation cycle from 25.04.2023 to 23.05.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych				
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Płytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)	(0,5 ÷ 100) mm	$\sqrt{(55)^2 + (1,01)^2 \cdot l_n^2}$ nm, gdzie l_n długość nominalna płytki wzorcowej w mm	S	Procedura wewnętrzna IW-01 oparta na normie PN EN-ISO 3650:2000
Suwmiarki	(0 ÷ 150) mm	30 μm		Procedura wewnętrzna IW-03 oparta na normie PN EN-ISO 13385-1:2019

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 188

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI**

TADEUSZ MATRAS
dnia: 25.04.2023 r.

